S	earch Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/718,176	CHIU ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Ninh H. Nguyen	3745	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
Updated		6/14/2005	NHN
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner

(INCLUDING SEA		1	
	D,	ATE	EXMR
Updated East search	6/14	/2005	NHN
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
•			
			
· ·			